

FT110A

HITACHI
Inspire the Next

日立

每毫米或微米都举足轻重



镀层

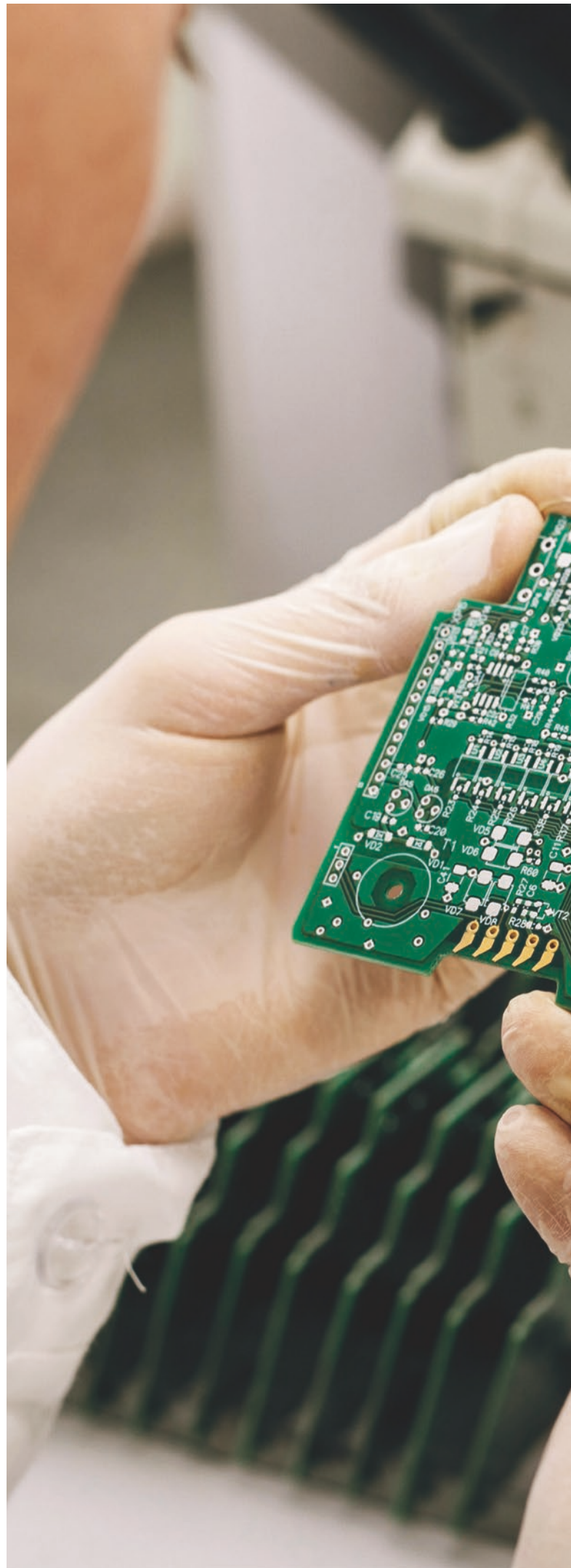
FT110A — 测量 极小目标

FT110A 帮助诸多的行业确保符合电镀规范，以避免出现性能低下的风险以及与废料或返工相关的成本。此外，该仪器可减少一系列测量所需的时间，从而帮助提高生产力。

在任何质量保证或质量控制系统中，准确性和可靠性均至关重要，拥有改良的 X 射线荧光技术的 FT110A 将使您的产品满足最高标准的行业规范要求。

借助更新的成像系统、全新的自动测量定位功能和大型样品台，确保这台镀层分析仪易于使用并提高分析效率。

基于 Windows 系统的 X-ray Station 软件提供直观的用户界面，用户可对该仪器进行全面控制。通过将数据直接整合到 Microsoft™ Word 和 Excel 中来简化您的质量保证/质量控制流程。



为何如此多的实验室改为使用 FT110A?



快速分析

强大的高灵敏度分析组件可以在数秒内测量镀层厚度和成分。



无损

X 射线荧光是无损分析过程，不留任何痕迹。即使是对敏感性材料，其测量也是安全的；同时无需丢弃被测量过的样品。



提高生产力

FT110A 的自动化功能意味着您可以更快地准备和测量样品，从而提高您的分析量。



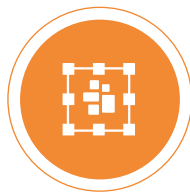
多功能性

FT110A 可以分析多达四层镀层和基材。可以使用基本参数 (FP) 或经验校准来测量镀层和材料成分 (如金属合金或电镀液)。



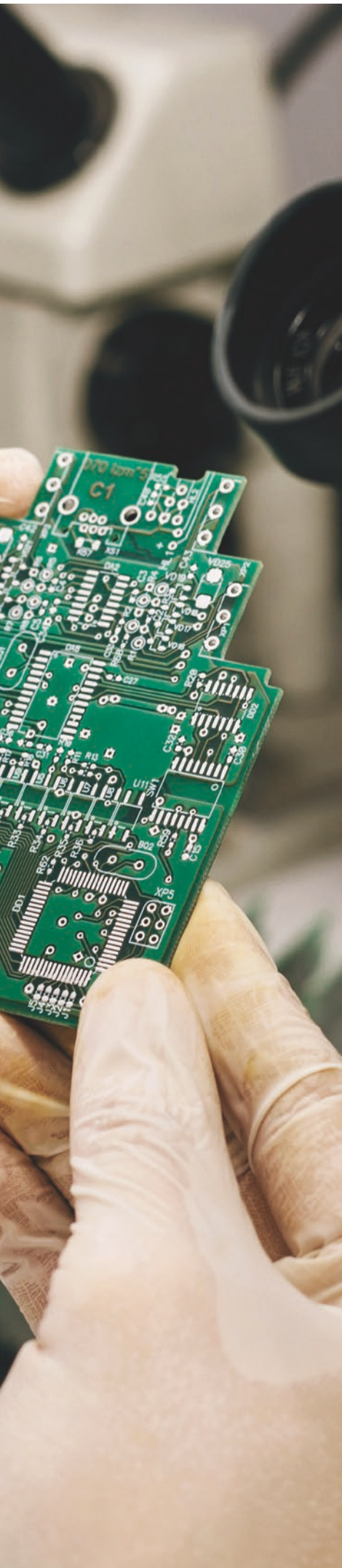
易于使用

培训可轻松完成，因此任何人都可以操作 FT110A。只需在工作台上设置样品，借助友好的界面指定测量区域，然后开始记录读数。用户界面可配置为仅显示日常操作所需的功能。



兼容性

测量方法符合标准 ISO 3497、ASTM B568 和 DIN 50987。



强大性和灵活性

FT110A 拥有一系列标准功能，能够以前所未有的快速性和简便性测量镀层厚度，而操作员可以通过选择多种选项来对其进行调整和增强...



特点

多准直器组件 – 0.1 和 0.2 毫米双准直器是标准配置，可灵活处理不同尺寸的零件。

广泛的分析范围 – 可确定从钛 (22) 到铀 (92) 等元素的镀层厚度。

校准和 FP 方法 – 使用经验和基本参数方法来确定薄膜厚度和成分。

大型测量室尺寸 – FT110A 可容纳尺寸高达 500 x 400 x 150 毫米且重量达到 10 千克的样品。

一键式测量 – 使用中心搜索功能进行简化的自动测量意味着几乎任何人都可以测试样品。

可选件

四准直器组件 – 通过加入 0.05 毫米和 0.025 x 0.4 毫米准直器，FT110A 的多功能性得以显著提升。

广视角相机 – 获取样品的鸟瞰图，然后快速放大您选择的测试区域。

自动对焦功能 – 无论样品厚薄或大小如何，FT110A 都可在几秒钟内自动对样品进行对焦。可从远至 80 毫米 (3.1 英寸) 的距离测量样品，非常适合测量具有凹陷区域的零件，或者适用于测量不同高度的多个样品。

图像处理软件 – 使用图案识别软件快速的对复杂样品进行分析。操作员只需将测量区域放入视域，软件就会自动进行位置微调。

40多年来,日立分析仪器一直走在 X 射线荧光技术应用的前沿, 并开发了全系列的分析仪器。

我们的服务

日立分析仪器的全球服务中心网可以为您正常工作提供全面的技术支持：



技术服务台

无论您何时遇到问题，我们都随时为您提供帮助。



在线诊断

透过我们的网站提供深入而快速的支持。



培训

帮助您充分利用分析仪及其全面的功能。



延长保修期

让您完全安心使用且不产生计划外费用。



维修服务

我们通过服务协议提供快速高效的维修服务、再认证和维护，确保了您的分析仪时刻保持极佳状态，避免产生计划外的费用。



您所在的国家或地区可能要求操作员在使用基于 X 射线设备时接受基本安全培训。

接下来

立即通过

contact@hitachi-hightech-as.com

联系我们的专家之一，安排进行演示。

更多信息

如需了解有关 FT110A 镀层厚度测量仪的更多内容，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha



其他产品

凭借 40 多年开发 XRF 分析仪的丰富经验，我们为客户带来一系列相关产品：

- | **FT150** 易于使用，同时具备强大且精密的功能，其毛细管聚焦光学技术可确保为 PCB 和半导体晶片市场提供精确的微点测量。
- | **X-MET8000 手持式分析仪**被成千上万的企业用于进行合金的简单、快速和无损分析，以及通过精密 XRF 技术实施废料金属分拣和金属牌号筛选。
- | **X-STRATA920 微光点 XRF 分析仪**可测量单层和多层涂层（包括合金层）的涂层厚度。X-Strata 专为研究实验室、质量控制或流程控制项目而设计，可容纳不同长度、尺寸和规模的样品。
- | **MAXXI 6** 采用超高分辨率的 SDD 技术、功能强大的软件以及超大尺寸的开槽测量室，可在最具挑战性的应用场景中测量多达 4 层涂层和基材。
- | **便携式测厚仪**相对便宜，为铜涂层测量提供了一种简单快速的解决方案。

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science 所有。本出版物仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science 承认所有商标和注册。

© Hitachi High-Tech Analytical Science 版权所有，2018 年。
保留所有权利。



可在 www.hitachi-hightech.com/hha
中浏览我们的全系列产品。